

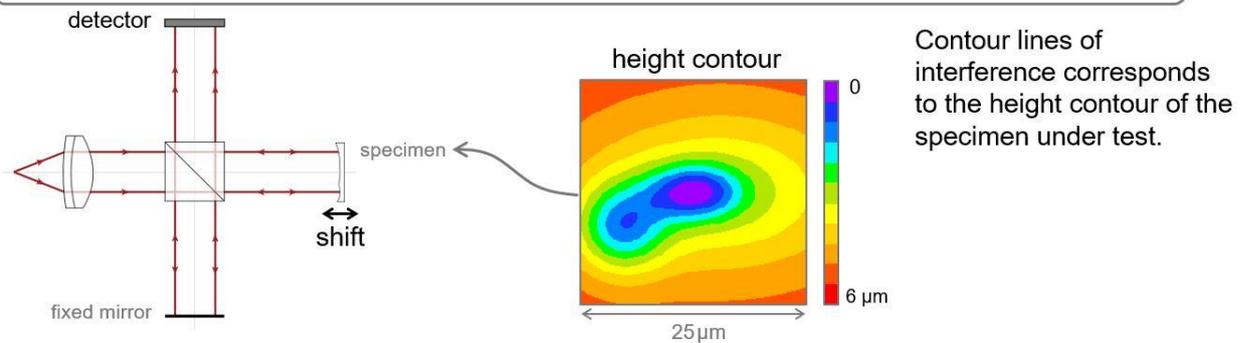
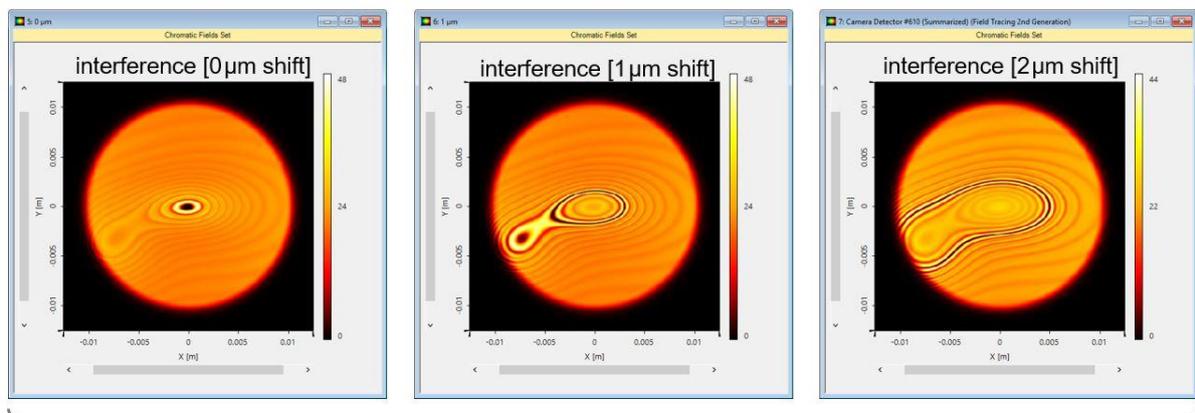
トポグラフィー走査干渉法とファブリー・ペローエタロン

干渉法は最も重要な光学計測技術の1つとして、様々な応用を可能にしてきました。ファブリー・ペローエタロンを用いた表面プロファイル測定とスペクトル測定のトポグラフィー走査干渉法の2例を紹介します。ノンシーケンシャル拡張機能のおかげで、VirtualLabでは両方のアプリケーションの光学系を容易にセットアップできます。それらの作動原理は明確に実証、可視化され、ノンシーケンシャルフィールドトレーシング技術は、このような光学系の高速かつ正確な解析を可能にします。

光トポグラフィー走査干渉法

コヒーレンスの低いキセノンランプ光源では、所与の試料の表面プロファイルを正確にスキャンするためのマイケルソン干渉計が構築されます。

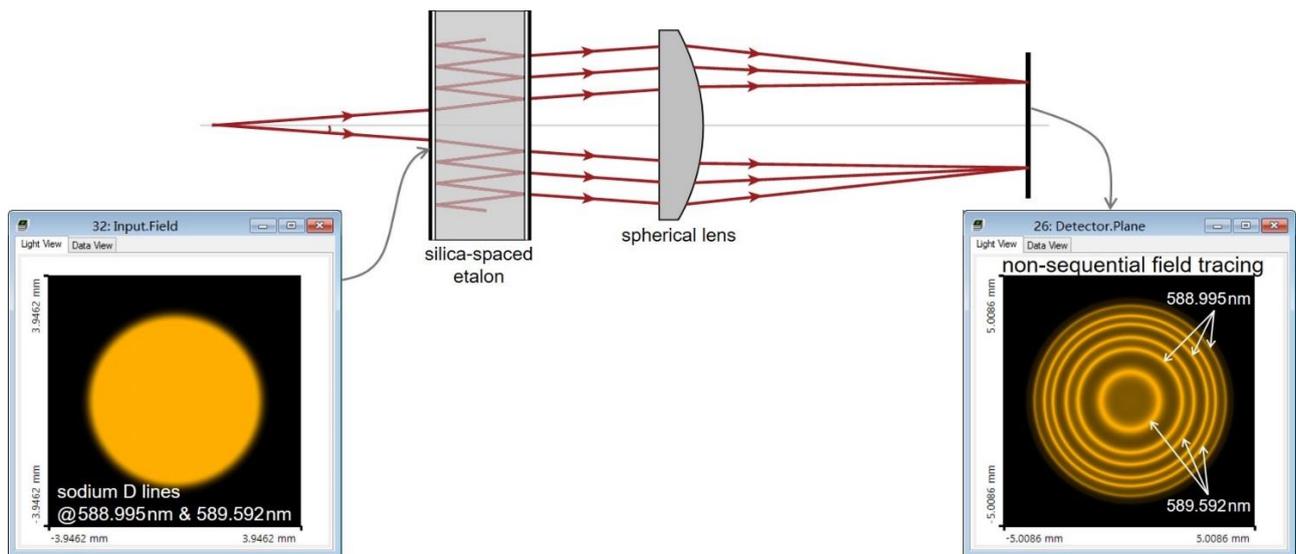
[詳しくはこちら](#)



エタロンによるナトリウム D 線の検査

シリカ製エタロンを構築し、VirtualLab Fusion のノンシーケンシャル フィールドトレーシング技術を用いてナトリウム D 線を測定するために使用します。

[詳しくはこちら](#)



☆無償トライアル版、トレーニングのお問い合わせは下記までお知らせください

株式会社プロリンクス

営業部 VirtualLab 担当

〒101-0035

東京都千代田区神田紺屋町 17 番地 SIA 神田スクエア 3 階

Tel: 03-5256-2053 / Fax: 03-5256-2272

Email: virtuallab@prolinx.co.jp

URL: <https://www.prolinx.co.jp/virtuallab/>

